

(株)ニコン

画像測定システムNEXIVVMZ-Sシリーズ中ストロークタイプ2VMZ-S4540T2



ブランド名

NIKON

商品名

画像測定システムNEXIVVMZ-S
シリーズ中ストロークタイプ2

型式

VMZ-S4540T2

品番

※この画像はシリーズ代表画像になります。

さまざまなサンプルをカバーする汎用モデルです。
千分台の公差管理を、高精度/スピーディー/簡単に。
ニコン光学技術が実現する、高精度・高速寸法測定。

画像測定システムNEXIV(ネクシブ)シリーズは、数十年に渡り、全世界、さまざまな産業分野で、厳しい品質管理や効率化のニーズに応えてきました。

NEXIV VMZ-Sシリーズは、今後拡大する車載向け電子部品や半導体をはじめ、精密機械部品、成型加工部品など様々なサンプルの測定、そして、さらに高度化していく測定ニーズに高精度・高速測定、および多彩なアプリケーションでお応えします。

各種モールド部品、中型フラットパネル、PCBに最適です。高さのある機械部品や各種治具を用いた測定も可能です。

スペック

カメラ：カラー 1/3型CMOS

最小表示：0.01 μ m

作動距離：50mm

測定精度：(Lは測定長さ)

EUX, MPE EUY, MPE 1.2 + 4L / 1000 μ m

EUXY, MPE 2.0 + 4L / 1000 μ m

EUZ, MPE1.2 + 5L / 1000 μ m

最大許容プロービング誤差: MPE PF2D 0.8 μ m

最大プローブプロービング誤差: MPE PFV2D 0.3 μ m

測定範囲X軸：450mm

測定範囲Y軸：400mm

測定範囲Z軸：200mm

倍率/視野：

被検物最大質量：